## Кинетика формирования фосфолипидного мультислоя на поверхности кремнезоля

А. М. Тихонов\*<sup>1)</sup>, В. Е. Асадчиков<sup>+</sup>, Ю. О. Волков<sup>+</sup>, Б. С. Рощин<sup>+</sup>, И. С. Монахов<sup>×</sup>, И. С. Смирнов<sup>×</sup> \*Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, 119334 Москва, Россия

+ Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН, 119333 Москва, Россия

<sup>×</sup> Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 101000 Москва, Россия

Поступила в редакцию 12 октября 2016 г.

Применив модельно-независимый подход к восстановлению профилей электронной концентрации по данным рентгеновской рефлектометрии, нами прослежен процесс упорядочения мультислоя из бислоев DSPC на кремнезольной подложке. По нашему мнению, электропорация бислоев в поле анионных наночастиц кремнезема значительно ускоряет процесс насыщения их Na<sup>+</sup> и H<sub>2</sub>O, что объясняет как относительно небольшое время формирования структуры мультислоя  $10^5 - 7 \cdot 10^5$  с, так и ~ 13-процентный избыток концентрации электронов в нем.

DOI: 10.7868/S0370274X16240115

Бислой из фосфолипидных молекул принято рассматривать, как простейшую модель клеточной мембраны [1–5]. Ранее нами сообщалось о кристаллизации на поверхности водного раствора аморфных наночастиц диоксида кремния мультислоя из фосфолипидных бислоев, толщина которого задается дебаевской длиной экранирования  $\Lambda_D$  в объеме гидрозольной подложки [6, 7] (рис. 1). В этой работе,



Рис. 1. Мультислой фосфолипидных бислоев

применив модельно-независимый подход к восстановлению профилей электронной концентрации по данным рентгеновской рефлектометрии, нам удалось проследить процесс упорядочения мультислоя, не используя никаких априорных предположений о его структуре [8–12]. Согласно нашим данным характерное время формирования структуры поверхности составляет  $10^5 - 7 \cdot 10^5$  с, по прошествии которого липидную пленку можно рассматривать как двумерный органический кристалл достаточно высокой степени совершенства.

В работе были исследованы мультислои 1,2дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолина (DSPC) или  $C_{44}H_{88}NO_8P$  [2]. Гидрофобная часть молекулы DSPC представляет собой две углеводородные цепи из 18 атомов углерода длиной  $\approx 2$  нм, а гидрофильная – образована глицерином и фосфохолином, ее длина  $\approx 1.5$  нм.

В качестве подложки использовались концентрированные монодисперсные гидрозоли наночастиц SiO<sub>2</sub>, стабилизированные гидроксидом натрия: Ludox SM-30 (диаметр наночастиц ~7 нм, с массовыми долями SiO<sub>2</sub> – 30 % и NaOH – 0.5 %, pH  $\approx$  10) и Ludox HS-40 (диаметр наночастиц ~12 нм, с массовыми долями SiO<sub>2</sub> – 40 % и NaOH – 0.4 %, pH  $\approx$  9.5) [13–16]. Порошок синтетического фосфолипида DSPC был приобретен у Avanti Polar Lipids, а кремнеземные гидрозоли у компании Grace-Davison.

В используемых растворах кремнезема параметр  $\Lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon k_B T / (N_A e^2 c^-)} \approx 400$  Å, где диэлектрическая проницаемость вакуума  $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \, \Phi/M$ , диэлектрическая проницаемость воды  $\epsilon \approx 80$ , постоянная Больцмана  $k_B \approx 1.38 \cdot 10^{-23} \, \text{Дж/K}$ , температура  $T \approx 298 \, \text{K}$ , число Авогадро  $N_A \approx 6.02 \times 10^{-23} \, \text{K}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: tikhonov@kapitza.ras.ru

 $\times 10^{23}$ моль<sup>-1</sup>, элементарный заряд  $e \approx 1.6 \cdot 10^{-19}$  Кл и  $c^- \approx 10^{-4}$ моль/л – концентрация свободных ионов ОН<sup>-</sup> в золе при рН = 10 [17, 18]. Из-за небольшой разницы в рН у раствора 12-нанометровых частиц кремнезема параметр  $\Lambda_D$  на  $\sim 40\%$  больше, чем у раствора 7-нанометровых частиц.

Отметим, из установленного по интенсивности малоуглового рассеяния распределения наночастиц по размерам следует, что характерный диаметр частиц в растворе на  $\sim 30$  % больше значения, декларируемого производителем [19, 20].

Образцы мультислоев приготавливались и изучались в герметичной ячейке с рентгенопрозрачными окнами в соответствии с методикой, описанной в работе [6]. На поверхность жидкой свежеприготовленной гидрозольной подложки, помещенной во фторопластовую тарелку диаметром 100 мм, с помощью шприца высаживались одна-две капли раствора фосфолипида в хлороформе ( $\sim 5 \cdot 10^{-2}$  моль/л) суммарным объемом  $\sim 10$  мкл. Таким образом на поверхности возможно сформировать мультислой из 10–20 монослоев липида. При таком нанесении поверхностно-активного вещества его избыток аккумулируется в трехмерных агрегатах, в равновесии с которыми находится фосфолипидная пленка.

Поперечное строение липидного слоя было исследовано методом рентгеновской рефлектометрии на лабораторном дифрактометре широкого назначения с подвижной системой излучатель - детектор [21]. В качестве излучателя используется рентгеновская трубка с медным анодом. С помощью кристалла-монохроматора однократного отражения Si (111) из спектра излучения трубки выбирается линия  $K\alpha_1$  (энергия фотонов E = 8048 эВ, длина волны  $\lambda = 1.5405 \pm 0.0001$  Å). Вертикальный размер пучка  $\sim 0.1$  мм, а горизонтальный  $\sim 8$  мм. Трехщелевая коллимационная система формирует зондирующий рентгеновский пучок, имеющий угловую ширину в плоскости падения  $\sim 10^{-4}$  рад. Угловое разрешение точечного детектора $\sim\!1.7\cdot10^{-3}\,\mathrm{pag}$ определяется входной щелью с зазором 1 мм на расстоянии  $\sim 570$  мм от центра образца. Для уменьшения поглощения и рассеяния излучения на воздухе применены вакуумные пути с рентгенопрозрачными окнами.

Если  $\mathbf{k}_{in}$ ,  $\mathbf{k}_{sc}$  – волновые вектора падающего и рассеянного луча в направление точки наблюдения соответственно, то вектор рассеяния  $\mathbf{q} = \mathbf{k}_{in} - \mathbf{k}_{sc}$ при зеркальном отражении имеет только одну ненулевую компоненту  $q_z = (4\pi/\lambda) \sin \alpha$ , где  $\alpha$  – угол скольжения в плоскости нормальной к поверхности (см. рис. 1). Программное обеспечение дифрактометра позволяет задавать переменный угловой шаг, ши-

Письма в ЖЭТФ том 104 вып. 11-12 2016

рину щели детектора и время экспозиции, что дает возможность оптимизировать измерение быстро спадающего с увеличением  $\alpha$  коэффициента отражения R.

При обработке экспериментальных данных сделана поправка на форму зондирующего рентгеновского пучка, поскольку в области малых углов лишь часть пучка попадает на поверхность образца. В области больших углов существенное влияние на угловую зависимость коэффициента отражения начинает оказывать фон. Его влияние учитывалось путем вычитания заранее измеренного среднего значения в этой угловой области, которое составляло  $\sim 0.1$  имп./с. Таким образом, собранные на дифрактометре данные для коэффициента отражения  $R(q_z)$ по пространственному разрешению  $2\pi/q_z^{\rm max} \approx 10\,{\rm \AA}$  $(q_z^{\rm max} \approx 0.5 \, {\rm \AA}^{-1}$  – максимальное значение  $q_z$  в эксперименте) сопоставимы с данными, полученными ранее при использовании синхротронного излучения [6, 7].

На рис. 2 показаны экспериментальные зависимости коэффициента отражения  $R(q_z)$  от поверхности



Рис. 2. Зависимость  $R(q_z)$  для поверхности кремнезоля: кружки – раствор 7-нанометровых частиц непосредственно после приготовления образца и спустя ~ 170 ч (квадраты); ромбы – раствор 12-нанометровых частиц после приготовления образца и спустя ~ 130 ч (треугольники). Линии – результат подгонки при восстановлении профилей электронной концентрации

чистых границ кремнезолей 7-нанометровых (кружки, квадраты) и 12-нанометровых частиц (ромбы, треугольники). В области  $q_z \approx 0.05 \text{ Å}^{-1}$  на всех кривых присутствует характерная особенность, возникающая из-за расслоения компонентов подложки на границе раздела воздух–кремнезоль [22].

На рис. 3 приведены данные для  $R(q_z)$  от пленки фосфолипида DSPC, нанесенной на подложку из



Рис. 3. Кривые отражения  $R(q_z)$  от пленки DSPC на поверхности раствора 7-нанометровых частиц, измеренные непосредственно после нанесения (кружки), спустя ~ 24 ч (квадраты) и ~ 100 ч (треугольники). Линии – результат подгонки при восстановлении профилей электронной концентрации

кремнезоля 7-нанометровых частиц. Кружки соответствуют отражению от образца в течение первого часа. Характерная особенность вблизи  $q_z \approx 0.05 \,\text{\AA}^{-1}$ инвертирована по форме: вместо минимума интенсивности наблюдается слабо выраженный максимум, что свидетельствует о существенной перестройке области расслоения. Квадратами показана кривая отражения от того же образца спустя  $\sim 24$  ч после нанесения липида. На этой кривой присутствует регулярный набор пиков отражения с периодом осцилляции  $\Delta q_z = 0.094 \pm 0.007 \,\text{\AA}^{-1}$ , который соответствует упорядоченной структуре с оценочным периодом  $2\pi/\Delta q_z = 66.8 \pm 4.5$  Å. Треугольники соответствуют кривой отражения от мультислоя липида DSPC, выдержанного в течение ~ 100 ч. Форма пиков отражения, а также их период $\Delta q_z = 0.096 \pm 0.012 \, {\rm \AA}^{-1}$ почти совпадают с периодом и формой пиков на предыдущей кривой.

На рис. 4 представлены зависимости  $R(q_z)$ для толстого мультислоя фосфолипида DSPC, сформированного на подложке из кремнезоля 12нанометровых частиц. Измерения были проведены спустя ~24 ч (кружки), ~70 ч (квадраты) и ~200 ч



Рис. 4. Кривые отражения  $R(q_z)$  от пленки DSPC на поверхности кремнезоля 12-нанометровых частиц, измеренные спустя 1 сутки после нанесения (кружки), спустя ~ 70 ч (квадраты) и ~ 200 ч (треугольники). Линии – результат подгонки при восстановлении профилей электронной концентрации

(треугольники) после приготовления образца. Как и в предыдущем случае, на всех кривых присутствуют регулярные, сужающиеся со временем, пики отражения с шагом  $\Delta q_z = 0.096 \pm 0.009 \,\text{\AA}^{-1}$ .

При измерениях  $R(q_z)$  происходит статистическое усреднение вклада латеральных неоднородностей структуры по области пятна засветки образца, характерная площадь которого составляет  $S \approx$  $\approx 100 \text{ мм}^2$ . Это позволяет рассматривать строение приповерхностного слоя образцов в приближении идеальной слоисто-неоднородной структуры. При анализе данных рефлектометрии нами был применен безмодельный подход, предложенный Кожевниковым [8, 11]. Существенное его преимущество заключается в том, что не требуется никаких априорных предположений о виде изучаемой структуры, в отличие от широко используемого модельного подхода [23–27].

Безмодельный подход основан на экстраполяции асимптотического поведения кривой отражения  $R(q_z)$  в область больших  $q_z$ . При этом предполагается, что распределение поляризуемости поперек поверхности образца  $\delta(z)$ , или ее производные в точках  $z_j$ , испытывают скачки [11, 12]. Если все расстояния между  $z_j$  различны, то существует всего два физически разумных распределения  $\delta(z)$ , соответствующих коэффициенту отражения  $R(q_z)$ , измеренному в ограниченном интервале qz. Эти распределения отличаются друг от друга последовательностью расположения точек  $z_i$  относительно границы подложки. Далее нами выбиралось решение, при котором первой точке разрыва  $z_1 = 0$  соответствует граница воздух-мультислой, а остальные  $z_i$  находятся в глубине вещества ( $z_i < 0$ ). При описании исследуемых образцов оказалось достаточным рассмотреть только точки разрыва нулевого и первого порядков, т.е. скачкообразное изменение в самой  $\delta(z)$  и ее производной  $\delta'(z)$  соответственно. Численная оптимизация профилей  $\delta(z)$  осуществлялась путем подгонки расчетной кривой отражения (функции  $\delta(z)$  и  $q_z$ ) к экспериментальным данным  $R(q_z)$  с использованием стандартного алгоритма Левенберга-Марквардта [28].

Для слабопоглощающих веществ в жесткой области спектра рентгеновского излучения из восстановленных распределений оптической постоянной  $\delta(z)$ возможно рассчитать модельно-независимые профили электронной концентрации по глубине  $\rho(z) \simeq$  $\simeq \pi \delta(z)/(r_0\lambda^2)$ , где  $r_0 = 2.814 \cdot 10^{-5}$  Å – классический радиус электрона [29]. Далее при сопоставлении восстановленного профиля  $\rho(z)$  с какой-то структурной моделью поверхностного слоя возможно оценить удельную площадь A на одну структурную единицу (ион, молекула или химическая группа) в слое толщиной  $d = z_2 - z_1$ :

$$A = \frac{\Gamma}{\int\limits_{z_1}^{z_2} \rho(z) dz},\tag{1}$$

где  $\Gamma$  – число электронов в структурной единице. Например, для молекулы DSPC  $\Gamma = 438$  электронов.

Все зависимости  $R(q_z)$  на рис. 2 спадают  $\propto 1/q_z^4$ . Дальнейший анализ показывает, что в  $\delta(z)$  имеется только одна особая точка нулевого порядка. На рис. 5а приведены восстановленные профили  $\rho(z)$  в приповерхностном слое золя 7-нанометровых частиц, нормированные на электронную концентрацию в воде при нормальных условиях  $\rho_w = 0.333 \, {\rm e}^-/{\rm \AA}^3$ . Они качественно соответствуют модели электрического двойного слоя, предложенной ранее в [17, 18]. Толщина наиболее плотного слоя (рыхлый монослой наночастиц) с максимумом, расположенным на глубине  $\sim 150$  Å, составляет  $\approx 100$  Å и примерно соответствует диаметру наночастиц SiO<sub>2</sub> в золе. Непосредственно после приготовления образца (штриховая линия) максимальная электронная концентрация в этом слое  $\rho_{\rm max} \approx 1.3 \rho_w$  на  $\sim 12\%$  превышает значение в объеме раствора  $\rho_b \approx 1.15 \rho_w$ , т.е. концентрация наночастиц в этом слое превосходит объ-



Рис. 5. Восстановленные профили распределений  $\rho(z)$ , нормированные на электронную концентрацию в воде  $\rho_w = 0.333 \,\mathrm{e^-/\AA^3}$ : (а) – поверхность золя 7нанометровых частиц непосредственно после приготовления образца (штриховая линия) и по прошествии ~ 170 ч (сплошная линия); (b) – поверхность золя 12-нанометровых частиц после приготовления образца (штриховая линия) и по прошествии ~ 120 часов (сплошная линия)

емную в  $(\rho_{\rm max} - \rho_w)/(\rho_b - \rho_w) \approx 2$  раза. Одновременно на большей глубине наблюдается второй слой такой же толщины с концентрацией частиц диоксида кремния, на ~ 20 % превышающей объемную. Общая толщина наблюдаемой области расслоения достигает ~ 500 Å.

После выдержки образца в течение ~170 ч (сплошная кривая на рис. 5а) концентрация наночастиц в рыхлом монослое снижается на ~20%, его положение смещается вглубь подложки, а второй слой исчезает. Общая толщина области расслоения сокращается до ~300 Å, что согласуется с оценкой величины  $\Lambda_D \approx 400$  Å для этого раствора. Также непосредственно на границе раздела воздух– кремнезоль обнаруживается узкий ( $d_0 \approx 20$  Å) пик электронной концентрации.

Распределения электронной концентрации вблизи поверхности кремнезоля 12-нанометровых частиц на рис. 5b проявляют аналогичное поведение. Непосредственно после приготовления образца (штриховая линия) избыточная концентрация наночастиц SiO<sub>2</sub> в рыхлом монослое наночастиц превышает объемную в  $\approx 2$  раза. Помимо этого, на глубине  $\approx 550$  Å присутствует обедненный слой,  $\rho(z)$  в котором на  $\sim 6\%$  меньше, чем в объеме этого золя  $\rho_b \approx 1.2\rho_w$ . Таким образом концентрация частиц в этом слое на  $\sim 40\,\%$  меньше объемной.

884

Спустя ~ 120 ч (сплошная линия) глубинные обогащенный и обедненный слои исчезают, а концентрация наночастиц в рыхлом монослое снижается до ~ 1.4 от объемной. Общая толщина области расслоения сокращается с ~ 700 Å до ~ 400 Å  $\approx \Lambda_D$ . Также на поверхности проявляется тонкий слой толщиной  $d_0 \sim 20$  Å.

Поскольку все кривые на рис. 3 спадают  $\propto 1/q_z^6$ , то при дальнейшем рассмотрении предполагается наличие в структуре точек разрыва 1-го порядка. Восстановленные распределения электронной плотности по глубине  $\rho(z)$ , нормированные на  $\rho_w$ , приведены на рис. 6.



Рис. 6. Восстановленные профили распределений  $\rho(z)$ , нормированные на электронную концентрацию в воде  $\rho_w = 0.333 \,\mathrm{e}^-/\mathrm{\AA}^3$ , для пленки липида DSPC на поверхности золя 7-нанометровых частиц по прошествии после ее нанесения: 1 ч (a), 24 ч (b) и 96 ч (c)

Спустя 1 ч после приготовления (рис. 6а) на глубине до 350 Å ( $\sim \Lambda_D$ ) электронная концентрация превосходит объемную на 3–4 % и липидная пленка на поверхности кремнезоля, по-видимому, находится в неупорядоченном состоянии. Сравнение структуры приповерхностного слоя этого образца с рассмотренной выше поверхностью чистого золя указывает на исчезновение особенности, связанной с рыхлым монослоем наночастиц, т.е. при растекании липидной пленки происходит существенное перераспределение частиц. После 24 ч выдержки образца на восстановленном распределении электронной плотности (рис. 6b) на глубине до 350 Å наблюдается квазипериодическая структура с характерным линейным размером  $d \approx 68$  Å, что соответствует удвоенной длине молекулы DSPC ( $\approx 35$  Å).

Наконец, спустя ~ 100 ч на профиле  $\rho(z)$  (рис. 6с) присутствуют четыре выраженных липидных бислоя толщиной  $d = 68.1 \pm 0.9$  Å. Распределение электронной концентрации внутри каждого бислоя симметрично по глубине, что свидетельствует о хорошей упорядоченности молекул в них.

Угловые зависимости на рис. 4 спадают  $\propto 1/q_z^4$ , поэтому в ходе восстановления структуры предполагался нулевой порядок точек разрыва в распределении поляризуемости. На всех восстановленных распределениях электронной концентрации на рис. 7 обнаруживается структура из шести – восьми слоев с характерным периодом 66.7 ± 2.0 Å, соответствующим толщине бислоя DSPC. Общая толщина мультислоя при этом превышает 500 Å. Также непосредственно на поверхности присутствует неупорядоченный слой низкой плотности и толщиной порядка монослоя DSPC  $\approx 40$  Å.

Спустя одни сутки после приготовления образца (рис. 7а) электронная концентрация в бислоях вбли-



Рис. 7. Восстановленные профили распределений  $\rho(z)$ , нормированные на электронную концентрацию в воде  $\rho_w = 0.333 \,\mathrm{e}^-/\mathrm{\AA}^3$ , для пленки DSPC на поверхности золя 12-нанометровых частиц по прошествии после ее нанесения 24 ч (a), 70 ч (b) и 200 ч (c)

зи границы раздела воздух – фосфолипид существенно ниже, чем в бислоях вблизи кремнезольной подложки, а ее распределение внутри отдельных бислоев сильно асимметрично, что свидетельствует о неполном их упорядочении. Для наиболее упорядоченных бислоев на глубине 250–400 Å оценочная площадь на молекулу липида равна  $A = 37 \pm 2 \text{ Å}^2$ .

Спустя ~70 ч (рис. 7b) интегральная электронная концентрация бислоев практически не меняется  $(A = 36 \pm 2 \text{ Å}^2)$ , однако границы раздела между ними становятся более выраженными. Это свидетельствует об упорядочении структуры липидной пленки в латеральном направлении.

Наконец, спустя  $\sim 200$ ч (рис. 7с) распределение электронной плотности в пределах отдельных бислоев становится симметричным при неизменной интегральной электронной концентрации всей структуры.

Таким образом, согласно приведенным данным, на чистой границе воздух-кремнезоль образуется макроскопически плоская структура. Профили электронной концентрации, восстановленные с применением модельно-независимого подхода, согласуются с представлением о структуре электрического двойного слоя на поверхности гидрозоля [17, 18]. Градиент поверхностного потенциала на ней возникает благодаря разнице в потенциалах сил "электрического изображения" для катионов Na<sup>+</sup> и несущих большой отрицательный заряд ( $\sim 10^3$  электронов) наночастиц кремнезема (макроионов). При выдержке образца в пределах нескольких суток в приповерхностном слое кремнезоля происходит перераспределение наночастиц с формированием из них рыхлого монослоя. В результате плоскость наименьшего сближения анионных частиц с поверхностью составляет  $\sim 100$  Å, в то время как катионы Na<sup>+</sup> аккумулируются непосредственно на границе раздела в тонком слое пространственного заряда толщиной  $d_0 \sim 20\,{\rm \AA}$ [30, 31].

Совокупность полученных нами данных также демонстрирует процесс упорядочения со временем в мультислое фосфолипида DSPC, нанесенного на подложку из кремнезоля. Характерная толщина формируемой структуры, как и в случае чистой поверхности гидрозоля  $\sim \Lambda_D$ .

В пределах первого часа после нанесения липида на границе гидрозоль-воздух формируется тонкий слой толщиной  $\approx 130$  Å, отделенного от подложки пленкой из неупорядоченного вещества толщиной  $\sim 200$  Å. При этом особенность на кривой отражения, которая связана с рыхлым монослоем из наночастиц, практически полностью исчезает. Это

Письма в ЖЭТФ том 104 вып. 11–12 2016

свидетельствует о существенной перестройке поверхности. Такую структуру можно объяснить предполагая, например, что тонкий слой состоит из трех "жидких" липидных бислоев с площадью на молекулу  $A = 55.7 \pm 0.7 \text{ Å}^2$ . Это значение A согласуется, например, с оценкой для площади на молекулу в бислойных стенках везикул [4].

В течение следующих суток происходит формирование квазипериодической многослойной структуры, включающей пять-восемь частично упорядоченных липидных бислоев. Наконец, спустя несколько суток  $(10^5 - 7 \cdot 10^5 c)$  после приготовления образца, структура восстановленных профилей липидного мультислоя не меняется, а внутри отдельных бислоев возможно выделить тонкую структуру монослоев. Усредненное значение площади на молекулу в мультислоях составляет  $A = 36 \pm 2 \,\text{\AA}^2$ . Эта величина заметно меньше ее оценки из дифракционных данных  $A_0 = 41.6 \pm 0.7 \text{ Å}^2$  для кристаллических бислоев [2, 6]. Сопоставление A со значением  $A_0$  дает усредненную по мультислою избыточную электронную концентрацию  $\Gamma(A_0 - A)/A_0 = 60 \pm 20$  электронов на молекулу липида, что составляет от четырех до восьми ионов Na<sup>+</sup> и молекул H<sub>2</sub>O в расчете на одну молекулу DSPC. Наблюдаемая у бислоев зависимость распределения ho(z) от глубины может быть вызвана, как дефектами их заполнения, так и неоднородным накоплением в слоях Na<sup>+</sup> и H<sub>2</sub>O.

Отметим, что в случае малой поверхностной концентрации DSPC на поверхности кремнезоля образуется монослой. В этом случае расстояние между плоскостью наименьшего сближения наночастиц с поверхностью сокращается до толщины монослоя  $\approx 35$  Å и наблюдается конденсация наночастиц на его гидрофильную поверхность, при которой поверхностная концентрация частиц в  $\sim 2$  раза превышает объемную [18]. В рассматриваемом случае большой поверхностной концентрации DSPC положение плоскости наименьшего сближения частиц кремнезема с поверхностью задается толщиной мультислоя  $\sim \Lambda_D$ . При этом четкой границы между ним и рыхлым монослоем наночастиц не наблюдается, что указывает на уменьшение их поверхностной концентрации.

Ранее рядом авторов по результатам вычислений с использованием молекулярной динамики показано, что ионы Na<sup>+</sup> могут внедряться в фосфолипидные мембраны и формировать таким образом положительный поверхностный потенциал [32–34]. Однако, такой механизм может объяснить избыточную электронную концентрацию только в бислое непосредственно примыкающем к подложке, но не во всем мультислое.

Можно провести аналогию между формированием поверхностной структуры с переходным процессом в *RC*-контуре, в котором емкость электрического двойного слоя С и сопротивление мультислоя R подключены параллельно к источнику тока ионов Na<sup>+</sup>, генерируемого силами электрического изображения. Характерное время зарядки емкости  $\tau = RC \sim 10^5 - 7 \cdot 10^5 \,\mathrm{c}$ , где  $C \sim \epsilon_0 \epsilon_1 / \Lambda_D$ , а  $R \sim \rho \Lambda_D$  – гельмгольцевская емкость и сопротивление мультислоя на единицу площади соответственно. Следовательно, сопротивление бислоя DSPC на единицу площади  $\rho d \sim \tau d/(\epsilon_0 \epsilon_1) \approx 4 \cdot 10^7 - 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{Om} \cdot \mathrm{m}^2$ , при статической диэлектрической проницаемости мультислоя  $\epsilon_1 \approx 2$ . Значение  $\rho d$  значительно меньше сопротивления  $10^{10} - 10^{13} \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{M}^2$ , полученного ранее из измерений ионной проводимости у немодифицированных фосфолипидных мембран [35]. Другими словами, значение  $\tau$  для наблюдаемой структуры на два-пять порядков величины меньше, чем ожидаемое.

Электрическое поле у поверхности рыхлого монослоя наночастиц, ориентирующее в начальный момент диполи молекул DSPC, достигает значения E > $> 10^9$  В/м [31]. Падение напряжения  $\Delta V$  на толщине бислоя составляет  $\Delta V = Ed > 7$  В, т.е. заведомо выполняется условие для его электрической неустойчивости или электропорации ( $\Delta V \ge 0.1 \,\mathrm{B}$ ) [36–39]. При этом в мультислое, по-видимому, происходит образование некоторой пористой структуры, по которой осуществляется более эффективный, по сравнению с омической проводимостью, транспорт ионов Na<sup>+</sup> из объема гидрозоля к границе с воздухом [40, 41]. По нашему мнению, такой механизм переноса заряда объясняет как относительно небольшое значение для  $\tau$ , так и высокую электронную концентрацию в бислоях.

Авторы благодарны И.В. Кожевникову за полезные обсуждения результатов экспериментов. Работа частично выполнена при содействии РФФИ (грант #15-32-20935).

- 1. E. Gorter and F. Grendel, J. Exp. Med. 41, 439 (1925).
- D. M. Small, The Physical Chemistry of Lipids, Plenum Press, N.Y. (1986).
- Phospholipids handbook, ed. by G. Cevc, Marcel Dekker Inc, N.Y. (1993).
- N. Kučerka, M.-P. Mieh, and J. Katsaras, Biochim. Biophys. Acta 1808, 2761 (2011).
- O.S. Andersen and R.E. Koeppe, II, Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 36, 107 (2007).
- 6. А.М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ **92**, 394 (2010).

- А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, Письма в ЖЭТФ 102, 536 (2015).
- I. V. Kozhevnikov, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 508, 519 (2003).
- I. V. Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler, Phys. Rev. B 85, 125439 (2012).
- А. В. Виноградов, И. В. Кожевников, Труды ФИАН 196, 18 (1989).
- 11. И.В. Кожевников, *Теория дифракции рентгеноского* излучения от неоднородных слоистых сред, дис. на соиск. степ. док. физ.-мат. наук, ИК РАН (2013).
- 12. Ю.О. Волков, Диагностика поверхностей твердотельных и комплексных жидкофазных систем методами рентгеновской рефлектометрии и диффузного рассеяния в условиях скользящего падения излучения, дис. на соиск. степ. канд. физ.-мат. наук, ИК РАН (2015).
- 13. T. Graham, Trans. Roy. Soc. (London) 151, 183 (1861).
- J. W. Ryznar, Colloidal Chemistry: Theoretical and Applied, v.VI, ed. by J.B. Alexander, Reinhold Publishing Corporation, N.Y., USA (1946).
- R. K. Iler, The Chemistry of Silica, Wiley-Interscience, N.Y. (1979).
- J. Depasse and A. Watillon, J. Colloid and Interface Sci. 33, 430 (1970).
- 17. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys 124, 164704 (2006).
- 18. A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. C 111, 930 (2007).
- В. Е. Асадчиков, В. В. Волков, Ю. О. Волков, К. А. Дембо, И. В. Кожевников, Б. С. Рощин, Д. А. Фролов, А. М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ 94, 625 (2011).
- 20. В.В.Волков, частное сообщение.
- 21. В.Е. Асадчиков, В.Г. Бабак, А.В. Бузмаков и др., Приборы и техника эксперимента **2**, 1 (2005).
- 22. A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. B 110, 2746 (2006).
- 23. H. Mohwald, Annu. Rev. Phys. Chem. 41, 441 (1990).
- J. Daillant, L. Bosio, B. Harzallah, and J. J. Benattar, J. Phys. II 1, 149 (1991).
- M. L. Schlossman, M. Li, D. M. Mitrinovic, and A. M. Tikhonov, High Performance Polymers 12, 551 (2000).
- A. M. Tikhonov, M. L. Schlossman, J. Phys.: Condens. Matter 19, 375101 (2007).
- M. Tolan, X-ray Scattering from Soft-Matter Thin Films, Springer Tracts in Modern Physics 148, Springer (1999).
- J. Nocedal and S. Wright, Numerical Optimization, 2nd ed., Springer (2006).
- B. L. Henke, E. M. Gullikson, and J. C. Davis, Atomic Data and Nuclear Data Tables 54, 181 (1993).
- 30. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 126, 171102 (2007).
- 31. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 130, 024512 (2009).
- 32. S. A. Pandit, D. Bostick, and M. L. Berkowitz, Biophys. J. 82, 1818 (2002).

- M. Yi, H. Nymeyer, and H.-X. Zhou, PRL **101**, 038103 (2008).
- 34. R. D. Porassoa and J. J. L. Cascalesa, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 73, 42 (2009).
- A. Goldup, S. Ohki, and J. F. Danielli, Recent Progress in Surface Science 3, 193 (1970).
- 36. J. M. Crowley, Biophys. J. 13, 711 (1973).
- 37. U.Zimmermann, G.Pilwat, and F.Riemann, Biophys. J. 14, 881 (1974).
- 38. И.Г. Абидор, В.Б. Аракелян, В.Ф. Пастушенко, М.Р. Тарасевич, Л.В. Черномордик, Доклады Академии Наук СССР **240**, 733 (1978).
- 39. R. Benz, F. Beckers, and U. Zimmerman, J. Membr. Biol. 48, 181 (1979).
- K. C. Melikov, V. A. Frolov, A. Shcherbakov, A. V. Samsonov, Yu. A. Chizmadzhev, and L. V. Chernomordik, Biophys. J. 80, 1829 (2001).
- 41. M. Tarek, Biophys. J. 88, 4045 (2005).